

TEM 観察用薄膜試料加工講習会のご案内

宮崎大学産学・地域連携センター
機器分析支援部門長 准教授 境健太郎

日頃より宮崎大学産学・地域連携センター機器分析支援部門の活動をご支援いただき感謝申し上げます。

当部門では、学内外との共同研究・学内研究支援による研究の活性化を図るために、各種分析機器を集中管理し、学内外の教育・研究の共同利用に提供すると共に、機器による分析及び分析技術の研究開発等を行ない教育研究の進展に役立てることを目的として設立された機関です。その目的を遂行する一環として、大学連携研究設備ネットワークの九州地区共同研究事業の助成を受け、透過電子顕微鏡（TEM）観察用半導体薄膜試料加工講習会を開催いたします。

半導体、セラミックス、金属のような硬質な試料の TEM 観察には、イオンミリングによる試料の薄膜化を行う必要があります。本学では日本電子（株）のイオンスライサーを所有しており、学内外から試料加工の要望に応じております。イオンスライサーは熟練した技術を必要とする従来法に比べて試料加工工程が簡略化されており、より気軽に試料加工が行えるようになっております。本講習会では日本電子（株）によるイオンスライサーのご講演と、主に半導体材料の断面 TEM 観察用の試料加工の講習を本学技術職員により行い、九州地区の TEM 関連の研究に従事する皆様方との交流を深め、また今後大学連携研究設備ネットワークを通して九州地区の皆様にご活用いただければと思っておりますので、是非ご参加くださるようお願い申し上げます。

記

場 所：宮崎大学 産学・地域連携センター

機器分析支援部門 共同利用者控室・試料作成室

日 時：2012年12月13、14日（木、金）13：30より

参加費：無 料

主 催：宮崎大学 産学・地域連携センター

共 催：大学連携研究設備ネットワーク

以上

講習会次第

2012年12月13日(木)

13:30~15:00 ご挨拶とご講演

講演題目「イオンライサーの概略と試料作成法の紹介」(仮題)

日本電子株式会社 河原 尚様

15:20~18:00 イオンライサー講習会(試料切り出しと装置への試料セット)

2012年12月14日(金)

9:00~12:00 イオンライサー講習会(1次ミリング)

13:00~15:00 イオンライサー講習会(2次ミリング)